

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
115-4-1

QC 400201

1983

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1993-03

Amendement 1

**Résistances fixes utilisées dans
les équipements électroniques**

Partie 4:

Spécification particulière-cadre:
Résistances fixes de puissance
Niveau d'assurance E

Amendment 1

**Fixed resistors for use
in electronic equipment**

Part 4:

Blank detail specification:
Fixed power resistors
Assessment level E

© CEI 1993 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

B

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

La présente modification a été établie par le Comité d'Etudes No. 40 de la CEI: Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Le texte de cette modification est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
40(BC)761	40(BC)797

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote correspondant mentionné dans le tableau ci-dessus.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de spécification dans le Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).

Page 14

Tableau III

Sous-groupe ClB, paragraphe 4.20 Secousses

Ajouter dans les "Conditions d'essai" après "Nombre de secousses: 4 000":

"ou

Accélération: 98 m/s²

Nombre de secousses: 1 000"

This amendment has been prepared by IEC Technical Committee No. 40: Capacitors and Resistors for Electronic Equipment.

The text of this amendment is based upon the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting
40(CO)761	40(CO)797

Further information can be found in the relevant Report on Voting indicated in the table above.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Page 15

Table III

Sub-group ClB, Subclause 4.20 Bump

Add in "Conditions of test" after "Number of bumps: 4 000":

"or

Acceleration: 98 m/s²

Number of bumps: 1 000"
